

CEI 60749-2
(Première édition – 2002)

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –
MÉTHODES D'ESSAIS MÉCANIQUES
ET CLIMATIQUES –

Partie 2: Basse pression atmosphérique

IEC 60749-2
(First edition – 2002)

SEMICONDUCTOR DEVICES –
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS –

Part 2: Low air pressure

CORRIGENDUM 1

Page 2

Au lieu de:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2012.

lire:

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

Page 3

Instead of:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2012.

read:

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007.

iTeh Standards
(<https://standards.iteh.ai/>)
Document Preview

[IEC 60749-2:2002/COR1:2003](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/112b2d5e-eb5e-4c09-aec2-568a94f89c9b/iec-60749-2-2002-cor1-2003)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/112b2d5e-eb5e-4c09-aec2-568a94f89c9b/iec-60749-2-2002-cor1-2003>